

Fernando Obelleiro Basteiro



Categoría: Catedrático de Universidade

Departamento: Teoría do Sinal e Comunicacions (t14)

Materias:

- [Física: Campos e Ondas \(GETT\)](#)
- [Física: Campos e ondas \(GETT-inglés\)](#)

Titorías:

1C: Lunes 13-15, Miércoles 13-15, Viernes 13-15

2C: Lunes 13-15, Miércoles 13-15, Viernes 13-15

Xuño-xullo 2019: Lunes 13-15, Miércoles 13-15, Viernes 13-15

Despacho: A-301

Centro: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (Pontevedra)

Email: obi@com.uvigo.es

Tlf: 986812120

Web Persoal: <http://www.com.uvigo.es/obi>

CV breve: "Nacido el 2/4/1968 en Forcarei (Pontevedra). Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo (UV) en Junio de 1991. Segundo Premio Nacional de Terminación de estudios de Ingeniería de Telecomunicación 1991. Doctor en Julio de 1994. Premio Extraordinario de Doctorado de la UV en Ingeniería de Telecomunicación, curso 1993-1994. Profesor Titular de Universidad Interino desde Octubre de 1994, Profesor Titular de Universidad desde Marzo de 1996 y Catedrático de Universidad desde Febrero de 2002. A septiembre de 2014 acredita: la dirección de más de 100 proyectos y contratos de I+D con empresas y organismos públicos. Autor de 92 artículos en revistas indexadas en el JCR y más de 150 contribuciones a congresos; sus trabajos científicos suman más de 1000 citas (Scopus), con un h-index de 17 (Scopus) Ha dirigido 5 tesis doctorales. Ha sido galardonado con dos premios internacionales: el PREMIO PRACE AWARD'09 EN LA INTERNATIONAL SUPERCOMPUTING CONFERENCE ISC'2009 y el ITANIUM INNOVATION AWARDS 2009 en la categoría "Computationally Intensive Applications", concedido por la Itanium Solutions Alliance (Intel). Sus principales líneas de investigación son: Computational electromagnetics, Fast integral equation methods, Multilevel Fast Multiple Algorithm (MLFMA), Method of Moments (MoM);

Metamaterials, Plasmonics, Biosensing, Nanoantennas, Nanotechnology; Radar Imaging (ISAR) and Radar Cross Section (RCS) measurement; Electromagnetic Compatibility (EMC, EMI, EMR); and others."